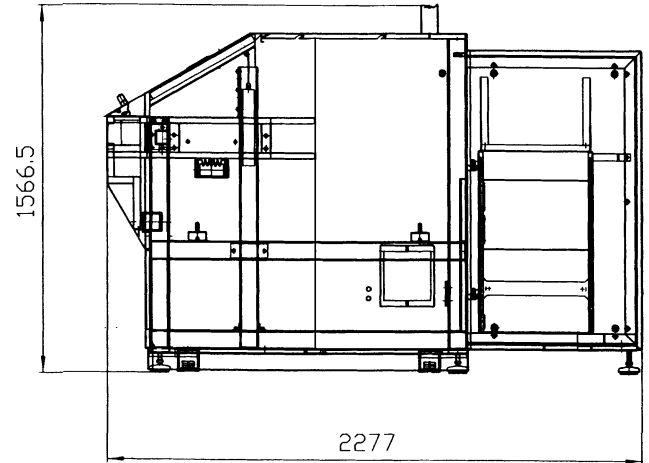
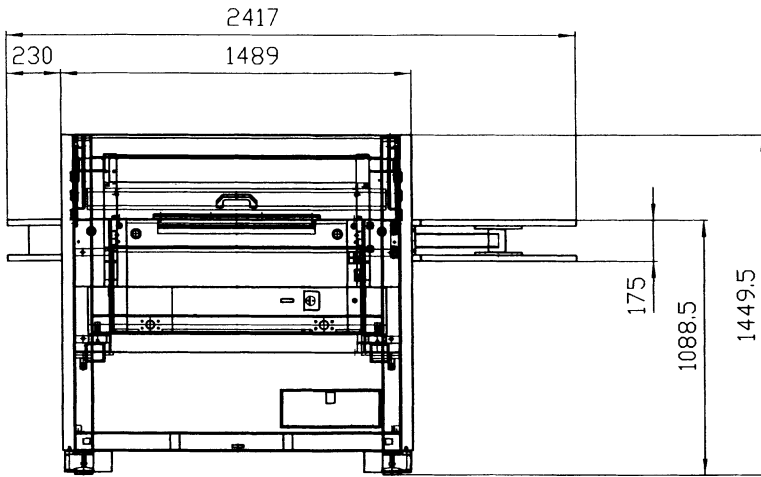


Technische Daten A 2



Systemausstattung

Testköpfe:	Bis zu 16 Testköpfe (8 oben, 8 unten)
Abgleichsystem:	CCD S/W Kameras für beide Produktseiten
Produkthalterung:	Zuführung manuell durch multi-sample-geeignetes Produkthuttle,
Automation:	Option

Positioniermechanik der Testfinger

Positioniergenauigkeit:	< $\pm 20 \mu\text{m}$
Wiederholgenauigkeit:	$\pm 10 \mu\text{m}$
Auflösung der Messsysteme:	5 μm
Minimaler Testpunktdurchmesser:	50 μm
Kontaktierabstand:	> 0,15 mm (6 mil)
Z-Achsenhub (programmierbar):	0,25 mm - 10 mm, programmierbar

Kontaktierdruck im gesamten Bereich:
10 g - 100 g ± 6 g, programmierbar und geregelt

Kamerasystem

Ermittlung von Produktposition und Produktverzug	
Kameraauflösung:	18 $\mu\text{m}/\text{Pixel}$ (optional 10 $\mu\text{m}/\text{Pixel}$)
Beleuchtung:	Stufenlose Anpassung an alle Produkte

Produkte

max. Testfeldgröße:	620 mm x 600 mm
max. Produktgröße:	670 mm x 650 mm
Leiterplattenstärke:	bis zu 10 mm

Testfeldgröße

465 mm x 600 mm (A 2/12 mit 12 Testköpfen)
620 mm x 600 mm (A 2/16 mit 16 Testköpfen)
Größere Testfelder auf Anfrage

Datenbasis für Testdaten:

ATF-Daten (+EPC-Daten), IPC-D-356A,
IPC-D-356 (+EPC-Daten)

Testparameter

Messstrom:	0,01 mA - 30 mA, 1 mA für HV-Widerstandsmessung
Messspannung:	10 V Hochspannungsmessung bis 500 V (Option)
Verbindungstest:	1 Ohm - 1 KOhm
Kurzschlussstest:	500 kOhm - 10 MOhm, optional 100 MOhm selektiv

Messmethoden:

Kurzschlussstest: elektrischer 100%-Test durch Feldmessmethode, echter Kurzschlussstest zwischen allen Lagen (kein Adjacency notwendig). Keine Vergleichsmessung, daher kurze Testzeiten.

Verbindungstest: 2-Punkt-Messung

Messbereich bis min. 1 Ohm

Testgeschwindigkeit: 100%-Test einer Leiterplatte mit 4000 TP / 1000 Netzen in ca. 3,5 min. (abhängig von Testpunktverteilung) bei Einsatz aller 16 Testköpfe
(Status: Softwareversion V1.4.0; permanente Geschwindigkeitssteigerungen durch neue Software-Releases)

Features

- 100% Isolationstest
(Standard: Testen ohne Adjacency), bei Bedarf Test mit Adjacency in verschiedenen Varianten
- Verbindungstest (min. 1 Ohm)
- High-Pitch / MCM-Testen
- Einstellbare und geregelte Fingerdruckkraft und Z-Achsen geschwindigkeit
- Multipanel-Testen, Multisample-Testen
- Unabhängige optische Abtastung von beiden Seiten des Produkts
- Shrinkagekompensation
- Komponententest (Widerstandstest)
- Hochspannungsmessung mit HV500-Karte
- LA-Test zur Auffindung von Leiterbahneinschnürungen (Option)
- Anschluss externer Messgeräte
- Automatische Selbstdiagnose
- Komfortable Bedienoberfläche unter Windows NT 4.0

Umgebungsbedingungen

Temperatur:	19° C - 27° C (21° ± 2 K für höchste Genauigkeit)
Luftfeuchte:	40 % - 60 %

Versorgung

Spannung:	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz (Option)
Druckluft:	6 bar, ca. 90 psi, gefiltert
Luftdurchfluss:	2,6 l pro Zyklus

Gewicht

A 2/12	ca. 1900 kg
A 2/16	ca. 2000 kg



atg test systems GmbH & Co. KG
Zum Schlag 3
D-97877 Wertheim
Tel.: 09342/2 91-0
Fax: 09342/3 95 10